

# 快速追蹤您的金屬分析 以安捷倫 7800 ICP-MS

The Measure of Confidence

## 解決方案就緒的安捷倫 7800 四極柱 ICP-MS

### 當預設方法與生產力工具結合了高性能 ICP-MS，其結果是非凡的

ICP-MS 以廣範圍的應用及樣品種類而成為被接受的常規微量元素分析技術。從環境監控、食品及消費產品檢測到生物組織、金屬、材料及地質樣品分析，在全球各地都是依賴 ICP-MS 檢測的。

這其中的許多行業，分析是依據標準方法或法規來完成的，所以分析需求和性能標準是被要求的。然而，樣品可能會有顯著的差異，所以儀器的耐用性與基質耐受度是基本的要求。另外，忙碌的合約實驗室人員也許需同時操作幾種技術。因此，方法設定的簡化及易於操作是有效率實驗室作業流程的一個關鍵。

新的安捷倫 7800 ICP-MS 含有常見應用的預設方法、以及創新的 Method Wizard 來簡化新樣品種類的方法設定。加上自動優化工具及標準操作程序 (SOP)，ICP-MS 從沒那麼容易使用過。



### 以安捷倫 7800 ICP-MS 分析雜質元素

SOP 包含：

- 通用方法範圍
- 標準的操作作業流程
- 干擾控制
- 樣品製備
- 預設方法參數
- 常規的維護
- 故障排除指南

更多訊息，請到：

[www.agilent.com/chem/7800icpms](http://www.agilent.com/chem/7800icpms)



**Agilent Technologies**

## 採用高基質導入 (HMI) 技術及氦氣 (He) 模式準確、可靠的定量結果

高或不同基質的樣品在許多應用中都會量測。因此，對於簡單的常規分析，ICP-MS 必須不僅只是耐受這些樣品，更需不要大幅修改設定的方法而持續產出準確的結果。

7800 ICP-MS 上的 HMI 技術降低了樣品基質載入到電漿中。HMI 使您能常規的分析更高基質水平 (高達 3% 總溶解固體 (TDS))，除了樣品稀釋一法之外，HMI 極小化信號由於基質的載入而抑制的現象。因此，相對於簡單的水溶液標準品，各種的高基質樣品可以準確的量測，消除了基質匹配的需求。

## 簡化金屬分析作業流程

- 標準操作程序
- 自動優化工具
- 預設方法及 Method Wizard
- 內建 QC、調校及樣品分析報告
- 選購的 ISIS 3 可快速連續進樣

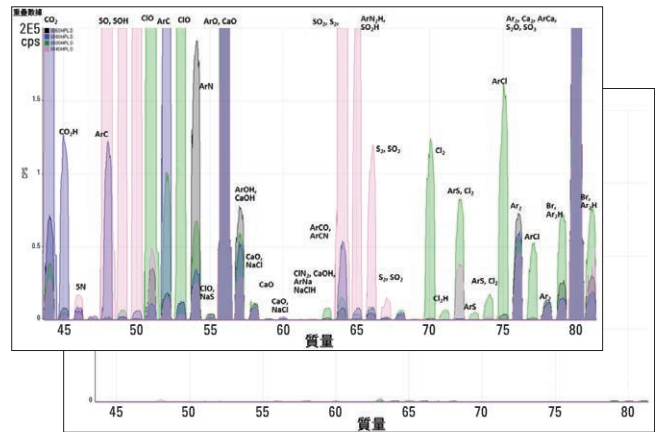
## 高通量連續進樣

安捷倫整合式樣品導入系統 (ISIS 3) 為 7800 ICP-MS 提供高通量連續取樣 (DS)，降低樣品分析時間至 <90 秒，針對複雜樣品在氦氣模式下，不須與去除干擾妥協。

## 針對去除干擾的氦氣模式

安捷倫八極柱 ORS 碰撞 / 反應池，針對氦氣碰撞模式優化，已經革新了複雜基質的 ICP-MS 分析。

7800 ICP-MS 上的氦氣模式降低所有的複合原子離子，它採用單一組一致的池條件，所以方法可以簡易的開發與轉移。也同時避免若使用反應性池氣體，對特定基質或特定待測元素需要特定池條件。氦氣模式也消除干擾校正方程式的需求，因為相同的池模式可以使用於不同的樣品，這消除了常見於校正方程式的錯誤，並且簡化方法開發。



氦氣池模式：混合基質空白樣的背景圖譜包含氮、氧、硫及碳。

上：無氣體模式，所有波峰都是來自於複合原子離子基質潛在的干擾

下：氦氣模式；所有的複合離子干擾都被去除

更多訊息，請到：

[www.agilent.com/chem/7800icpms](http://www.agilent.com/chem/7800icpms)

本資料中的資訊如有變更，恕不另行通知。

© 臺灣安捷倫科技股份有限公司，2015  
2015 年 6 月 1 日，臺灣印刷  
5991-5926CHTW

